



Quality Control Instrument

X-Rite Ci™52 ポータブル分光色測計

様々なサンプルのサイズ、基材、形状、生地、不透明度に対応し、正確で生産性の高い測定をサポートする柔軟性に富んだ測定器です。色と外観の同時測定でより優れた精度を発揮。本体はポータブル式測色計、または小型のベンチトップ式測色計としてご使用になることができます。また NetProfiler3 ソリューションによって、一貫した精度の高い性能を提供します。



X-Rite Ci52 の特長

万能：ハンドヘルドおよびベンチトップの両アプリケーションに対応。リモート測定スイッチで利便性も向上。

使いやすさ：ビジュアル（LED）と音声インジケータによる簡単操作。

測定の整合性を強化：ターゲットシェウとリモート測定機能で、測定が困難なサンプルにも対応します。

幅広いサンプルの種類やサイズにも対応：用紙、プラスチック、生地や硬い表面など 14mm 以上のサンプルを測定可能。

迅速かつ正確な測定：平らなまたは複雑な形状のサンプルでも測定時間は 2 秒です。

信頼性のある性能：反射光がどのように影響するかを判断するため、正反射光込み（色）と、正反射光除去（外見）の 2 通りの測定を同時に行います。

一貫した測定値：複数の装置で正確なカラー管理を發揮する優れた器差。

NetProfiler®3 に対応：搭載されたシステムは装置の性能を最適化し、リモートによる認定を可能にします。

スムーズな移行：既存のエックスライト製分光測色計との互換性を保ちます。

X-Rite Ci52 の仕様

光学幾何条件	d/8°、DRS 分光エンジン SPIN/SPEX 同時測定
測定径	φ8mmの測定径 ターゲットウィンドウ 14mm
光源	ガス充填タングステンランプ
受光部	青色増感シリコン・フォトダイオード
分光範囲	400 ~ 700nm
分光間隔	10nm - 測定 10nm - 出力
測定範囲	反射率 0 ~ 200%
測定時間	約2秒
器差	CIE L*a*b* 平均 0.20 ΔE*ab、 12 BCRA シリーズ II タイルに基づく。 (正反射光込み) 最大 0.40 ΔE*ab タイル種問わず (正反射光込み)
短期反復性	0.05 ΔE*ab ホワイト セラミック
NetProfiler のサポート	対応
変換サポート	対応
ランプ寿命	約 50 万回測定
電源	AC アダプター必要条件 90 ~ 130 VAC、100 ~ 240 VAC、 50 ~ 60 Hz、15W 最大
データ インターフェース	USB
操作温度範囲	10° ~ 40° C 最大相対湿度 85% (結露なし)
保存温度範囲	-20° ~ 50° C
重量	0.87 kg
外形寸法	高さ 10.9 cm、幅 9.1 cm、奥行 21.3 cm
標準アクセサリ	校正基準板：ブラックトラップ、 取り外し可能な白色/緑基準板、 使用説明書、AC アダプター、 コード付き USB ケーブル
オプション	ベンチトップ台、サンプル固定工具



■ お求め、ご相談は



エックスライト株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR 五反田 7F

Tel: 03-6825-1641 www.xrite.com

©2011, X-Rite, Incorporated. All rights reserved. L10-447JA-Paint (2011年5月)